

Materials

原材料、製品之評估解析

石英部材、電子工業級藥品等之高感度分析

Wafer

- 金屬膜中之微量金屬分析 : ICP-MS、SIMS
- 縱深方向分析 : SIMS、ICP-MS
- 極薄膜之組成分析 : XPS
- 基板表面附著有機物分析 : WTD-GC-MS
- 基板表面附著離子成分分析 : IC、CE、LC

石英部材

- 金屬不純物分析 : ICP-MS、GF-AAS
- 縱深方向分析 : ICP-MS、SIMS
- 溶出成分分析 : ICP-MS、IC
- 異物、汙點分析 : XPS、EPMA

電子工業級藥品

- 超微量金屬不純物分析 : ICP-MS
- 離子成分分析 : IC、CE、LC
- 溶出成分分析 : ICP-MS、CE-MS、LC-MS

碳材料

- 奈米粒子之型態觀察 : TEM、SEM
- 奈米粒子之構造解析 : XRD、Raman
- 不純物評估 : ICP-MS、GF-AAS、IC etc.

光阻、電鍍液

- 溶出成分分析 : IC、CE、LC-MS、CE-MS、ICP-MS
- 表面分析 : TOF-SIMS、XPS、 μ -IR、EPMA etc.
- 構造解析 : NMR、GC-MS、LC-MS、GPC etc.
- 逸出氣體分析 : GC-MS、EGA、PyGC-MS

高分子材料

- 構造解析 : NMR、GC-MS、LC-MS、GPC etc.
- 異物、汙點分析 : μ -IR、EPMA、XPS、TOF-SIMS etc.
- 逸出氣體分析 : GC-MS、EGA、PyGC-MS
- 溶出成分分析 : IC、CE、LC-MS、CE-MS、ICP-MS

金屬、陶瓷部品

- 溶出成分分析 : ICP-MS、GC-MS、IC、LPC etc.
- 異物、汙點分析 : μ -IR、EPMA、XPS、TOF-SIMS etc.
- 逸出氣體分析 : GC-MS